PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 08088419 A

(43) Date of publication of application: 02.04.96

(51) Int. CI H01L 41/083
H01L 41/22

(21) Application number: 06222179

(71) Applicant: KAWASAKI HEAVY IND LTD

(72) Date of filing: 16.09.94

(72) Inventor: YANASE ETSUYA
KASA YOSHITOKU
TOKAI MASAKUNI

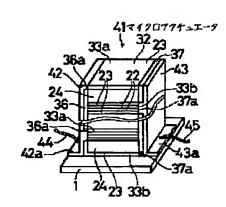
(54) MICRO-ACTUATOR AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a micro-actuator and its manufacturing method by which driving can be performed at a low voltage and the crystal property of a piezoelectric layer can be improved.

CONSTITUTION: A laminated body 32 of a micro-actuator 41 is constituted by laminating a specified laminating number of piezoelectric members having electrodes 23 on both sides of laminated layers 24 formed by a film forming steps using vapor deposition by the junction of an anode junction method. The connection of electrode layers 33a and 33b is performed through grooves 36a and 37a by forming the grooves 36a and 37a in insulating layers 36 and 37 after the formation of the insulating layers 36 and 37 aft the side surfaces of the laminated body 32. The thickness of a piezoelectric layer 24 is set at the value of 0.1-10µm. The piezoelectric layer 24 is constituted of a crystal. The C axis of the crystal is oriented in the thickness direction of the piezoelectric layer 24.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-88419

(43)公開日 平成8年(1996)4月2日

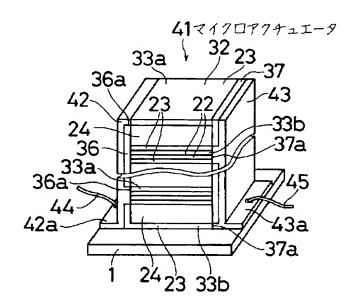
(51) Int.Cl. ⁶ H 0 1 L 41/083 41/22	識別記号 庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
		H01L 審査請求	41/ 08 Q 41/ 22 Z
			未請求 請求項の数9 OL (全 8 頁)
(21)出願番号	特願平6-222179	(71) 出願人	
(22)出顧日	平成6年(1994)9月16日		川崎重工業株式会社 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1 号
		(72)発明者	The state of the s
		(72)発明者	
		(72)発明者	
		(74)代理人	

(54) 【発明の名称】 マイクロアクチュエータおよびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 低電圧で駆動可能で、圧電層の結晶性を向上 することができるマイクロアクチュエータおよびその製造方法を提供する。

【構成】 マイクロアクチュエータ41の積層体32 は、蒸着による成膜工程によって形成された圧電層24 の両側に電極23を有する圧電部材が、陽極接合法による接合によって所定の積層数だけ積層されて構成される。電極層33a,33bと外部電極43との接続は、積層体32の側面に絶縁層36,37を形成した後、その絶縁層36,37に溝36a,37aを形成し、その溝36a,37aを介して行われる。圧電層24の厚さは、0.1μm~10μmの値に設定される。また圧電層24は結晶によって構成され、その結晶のC軸は圧電層24の厚み方向に配向されている。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電性および電歪性を有する圧電層と電 極層とが交互に積層される積層体の側面に、互いに対向 する一対の絶縁層が形成され、

奇数番目の各電極層の一端部および偶数番目の各電極層 の他端部に達する溝が、絶縁層の表面に複数形成され、 絶縁層の表面に、前記溝を介して電極層に電気的に接続 される外部電極が形成されることを特徴とするマイクロ アクチュエータ。

【請求項2】 前記圧電層が結晶で構成され、前記結晶 のC軸が圧電層の厚み方向に配向されていることを特徴 とする請求項1記載のマイクロアクチュエータ。

【請求項3】 積層体が電気絶縁性の基板に固定され、 基板に前記外部電極が接続される接続電極が設けられ、 その接続電極にリード線が接続されることを特徴とする 請求項1記載のマイクロアクチュエータ。

【請求項4】 前記圧電層が、0.1μm~10μmの 範囲の厚さを有することを特徴とする請求項1記載のマ イクロアクチュエータ。

【請求項5】 基板表面に、電極層、圧電性および電歪 20 性を有する圧電層、および電極層を順次蒸着し、圧電部 材を作製する成膜工程と、

2つの圧電部材を電極層が互いに対向するように接合す る接合工程と、

両端の2つの基板のうちの一方の基板を除去し、電極層 を露出させ、積層した圧電部材を作製する基板除去工程 とを備え、

接合工程と基板除去工程とを繰返して、所定の積層数だ け積層させた圧電部材を得ることを特徴とするマイクロ アクチュエータの製造方法。

【請求項6】 圧電性および電歪性を有する圧電層と電 極層とが交互に積層される積層体の側面に、互いに対向 する一対の絶縁層を形成する絶縁層形成工程と、

奇数番目の各電極層の一端部および偶数番目の各電極層 の他端部に達する溝を、絶縁層の表面に複数形成するエ ッチング工程と、

絶縁層の表面に、前記溝を介して電極層に電気的に接続 される外部電極を形成する外部電極形成工程とを備える ことを特徴とするマイクロアクチュエータの製造方法。

【請求項7】 積層体が固定された電気絶縁性の基板 に、前記外部電極が接続される接続電極を設け、接続電 極にリード線を接続することを特徴とする請求項6記載 のマイクロアクチュエータの製造方法。

【請求項8】 前記接合工程において、陽極接合法、表 面活性化接合法、または接着剤接合法が用いられること を特徴とする請求項5記載のマイクロアクチュエータの 製造方法。

【請求項9】 前記エッチング工程における溝の形成 は、FIB法、ドライエッチング法またはウェットエッ 載のマイクロアクチュエータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、入力された電気信号を 変位や力に変換するマイクロマシンの駆動源などに用い られ、与えられた変位や力を電気信号に変換する加速度 センサや超音波センサなどのセンサとしても使用可能な マイクロアクチュエータおよびその製造方法に関する。 [0002]

【従来の技術】従来のマイクロアクチュエータは、表面 に電極層となる導電性ペーストが塗布されたグリーンシ ートが積層された積層体を焼成し、焼成された積層体の 側面に、互いに対向する一対の外部電極が設けられて形 成される。積層体の奇数番目の各電極層の一端部、およ び偶数番目の各電極層の他端部が積層体の側面に露出し ている部分には、筋状の絶縁体がそれぞれ形成され、外 部電極は、絶縁体の上から積層体の側面に設けられ、電 極層が両側の外部電極に交互に接続される (特開平6-84409, 特開平6-120579)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述の従来技術では、 積層体の形成にグリーンシート法が用いられるので、グ リーンシートが焼成されて成る圧電層の厚さに下限、数 十μ mがあり、圧電層の厚さを薄くすることができな い。圧電層の厚さが厚いと、マイクロアクチュエータを 駆動するのに高い電圧、たとえば数百ボルトの電圧が必 要となり、その結果、通常のIC(大規模集積回路)で の駆動が困難である。

【0004】また、グリーンシート法で圧電層を形成す 30 ると、圧電層の結晶性が悪くなり、圧電層の圧電特性お よび電歪特性が悪くなる。

【0005】本発明の目的は、低電圧で駆動可能で、圧 電層の結晶性を向上することができるマイクロアクチュ エータおよびその製造方法を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、圧電性および 電歪性を有する圧電層と電極層とが交互に積層される積 層体の側面に、互いに対向する一対の絶縁層が形成さ れ、奇数番目の各電極層の一端部および偶数番目の各電 40 極層の他端部に達する溝が、絶縁層の表面に複数形成さ れ、絶縁層の表面に、前記溝を介して電極層に電気的に 接続される外部電極が形成されることを特徴とするマイ クロアクチュエータである。また本発明は、前記圧電層 が結晶で構成され、前記結晶のC軸が圧電層の厚み方向 に配向されていることを特徴とする。また本発明は、積 層体が電気絶縁性の基板に固定され、基板に前記外部電 極が接続される接続電極が設けられ、その接続電極にリ ード線が接続されることを特徴とする。また本発明は、 前記圧電層が、0.1μm~10μmの範囲の厚さを有 チング法によって行われることを特徴とする請求項6記 50 することを特徴とする。また本発明は、基板表面に、電

-2-

極層、圧電性および電歪性を有する圧電層、および電極 層を順次蒸着し、圧電部材を作製する成膜工程と、2つ の圧電部材を電極層が互いに対向するように接合する接 合工程と、両端の2つの基板のうちの一方の基板を除去 し、電極層を露出させ、積層した圧電部材を作製する基 板除去工程とを備え、接合工程と基板除去工程とを繰返 して、所定の積層数だけ積層させた圧電部材を得ること を特徴とするマイクロアクチュエータの製造方法であ る。また本発明は、圧電性および電歪性を有する圧電層 と電極層とが交互に積層される積層体の側面に、互いに 10 対向する一対の絶縁層を形成する絶縁層形成工程と、奇 数番目の各電極層の一端部および偶数番目の各電極層の 他端部に達する溝を、絶縁層の表面に複数形成するエッ チング工程と、絶縁層の表面に、前記溝を介して電極層 に電気的に接続される外部電極を形成する外部電極形成 工程とを備えることを特徴とするマイクロアクチュエー タの製造方法である。また本発明は、積層体が固定され た電気絶縁性の基板に、前記外部電極が接続される接続 電極を設け、接続電極にリード線を接続することを特徴 とする。また本発明は、前記接合工程において、陽極接 20 合法、表面活性化接合法、または接着剤接合法が用いら れることを特徴とする。また本発明は、前記エッチング 工程における溝の形成は、FIB法、ドライエッチング 法またはウェットエッチング法によって行われることを 特徴とする。

[0007]

【作用】本発明に従えば、マイクロアクチュエータは、 圧電性および電歪性を有する圧電層と、電極層とが交互 に積層される積層体と、奇数番目の各電極層の一端部お よび偶数番目の各電極層の他端部に達する溝が形成され 30 る絶縁層と、外部電極とを備えて構成される。積層体の 各電極層は、絶縁層に形成される溝を介して、両側の外 部電極のいずれか一方に交互に接続される。

【0008】外部電極間に電圧が印加されると、積層体 の互いに隣接する電極層間に、積層体の積層方向と平行 な電場が生じ、この電場による作用によって圧電層が、 厚み方向に伸び変位または縮み変位する。ここで、各電 極層の両側に生じる電場は、互いに逆向きとなってい

され、その結晶のC軸が圧電層の厚み方向、すなわち積 層方向に配向されている。このため、各電極層間に電圧 が印加された場合における圧電層の伸び変位率および縮 み変位率を大きくすることができ、また圧電層が外力に よって伸び変位または縮み変位された場合における互い に隣接する各電極間に生じる電位差を大きくすることが できる。その結果、従来のマイクロアクチュエータに比 べて、圧電特性および電歪特性に優れたマイクロアクチ ュエータを実現することができる。

に対して、マイクロアクチュエータが伸び変位または縮 み変位する大きさが大きくなるので、低電圧で駆動可能 で厚みの薄い小形化に適したマイクロアクチュエータを 実現することができる。

【0011】圧電特性が向上されると、マイクロアクチ ェエータがセンサとして用いられる場合、マイクロアク チュエータが伸び変位または縮み変位される大きさに対 して、互いに隣接する各電極層間に生じる電位差が大き くなるので、厚さの薄い小形のマイクロアクチュエータ で微小変位を高精度で検出することができる。

【0012】また本発明に従えば、積層体の各電極層 は、外部電極および基板に設けられる接続電極を介し て、リード線と電気的に接続される。したがって、リー ド線が接続電極に接続されるので、信頼性を向上させる ことができる。

【0013】また本発明に従えば、たとえばスパッタリ ング法を用いて圧電層を形成し、圧電層の厚さが0.1 μ m ~ 10 μ m の値に設定される。したがって、従来で は数十μm以上の厚さであった圧電層の厚さを、大幅に 薄くすることができ、その結果、従来では数百ボルトで あった駆動電圧を、大幅に小さく、たとえば数ボルトに することができる。これによって、通常のICによって マイクロアクチュエータを駆動することができる。

【0014】また本発明に従えば、マイクロアクチュエ ータの製造工程は、蒸着によって基板表面に電極層およ び圧電層を形成し、圧電部材を作製する成膜工程と、2 つの圧電部材を接合する接合工程と、基板を除去して電 極層を露出させる基板除去工程とを備える。接合工程と 基板除去工程とが繰返されることによって、圧電層と電 極層とが交互に所定の積層数だけ積層された圧電部材が 得られる。

【0015】したがって、蒸着によって圧電層および電 極層を形成するので、従来のグリーンシート法に比べて 圧電層および電極層の厚さを大幅に薄くすることができ る。電極層の厚さを薄くすることによって、マイクロア クチュエータの厚さを薄くすることができる。

【0016】また成膜工程で形成された厚さの薄い圧電 層および電極層を、接合工程と基板除去工程とを繰返す ことによって所定の積層数に積層するので、従来よりも 【0009】また本発明に従えば、圧電層が結晶で構成 40 厚さの薄い圧電層および電極層によってマイクロアクチ ユエータを形成することができる。

> 【0017】また本発明に従えば、マイクロアクチュエ ータの製造工程は、積層体の側面に、互いに対向する一 対の絶縁層を形成する絶縁層形成工程と、積層体に含ま れる奇数番目の各電極層の一端部および偶数番目の各電 極層の他端部に達する溝を絶縁層の表面に複数形成する エッチング工程と、絶縁層の表面に、外部電極を形成す る外部電極形成工程とを備えて構成される。

【0018】したがって、積層体の側面に絶縁層を形成 【0010】電歪特性が向上すると、印加する駆動電圧 50 した後、その電極層に溝を形成するので、従来の筋状の

-5

絶縁体を形成する場合に比べて作業を、高精度で、かつ 簡単に行うことができ、その結果、マイクロアクチュエ ータの製造工程の簡略化および歩留りの向上を図ること ができる。

[0019]

【実施例】図1は、本発明の一実施例のマイクロアクチュエータ41の構成を示す斜視図である。マイクロアクチュエータ41は、圧電層24と電極層33a,33bとが交互に積層される積層体32と、絶縁層36,37と、外部電極42,43と、基板1とを備えて構成され10る。基板1表面に形成された接続電極42a,43aには、ワイヤーボンディングなどによってリード線44,45が接続されている。

【0020】積層体32の側面には、互いに対向するように一対の絶縁層36,37が形成される。図1における左側の絶縁層36には、奇数番目の絶縁層33aの図1における左側端部に達する溝36aが複数形成され、図1における右側の絶縁層37には、偶数番目の電極層33bの図1における右側端部に達する溝37aが複数形成される。絶縁層36,37の表面に形成される外部電極42,43は、溝36a,37aを介して電極層33a,33bに導通する。

【0021】外部電極42,43の図1における下端部は、基板1の表面に形成される接続電極42a,43aと連なっており、本実施例では外部電極42,43と接続電極42a,43とは一体に形成される。両端部の電極層33a,33bは、単一の電極23で構成され、両側を圧電層24で挟まれた各電極層33a,33bは、2つの電極23と2つの接合層22とを備えて構成される。

【0022】マイクロアクチュエータ41の製造工程を 説明する。

【0023】図2は、基板1の表面に電極23、圧電層24、および接合層22を形成する成膜工程を示す図である。図3は、図2の成膜工程で作製された圧電部材21の構成を示す斜視図である。図1の成膜工程では、RF(radio frequency)マグネトロンスパッタ法が用いられる。基板1と、ターゲット2との間に、RF電源8によって高周波電圧を印加し、アルゴンプラズマを発生され、アルゴンイオン3aでターゲット2をスパッタし、ターゲット2を構成する原子または分子2aを基板1表面に蒸着する。

【0024】基板1は、ヒータ7によって蒸着に適した 温度に設定されている。永久磁石4は、基板1とターゲット2との間に発生する電場と直交する磁場を発生させ、これによって、アルゴンプラズマがターゲット2の 近傍に閉じ込められ、スパッタ効率が高くなっている。 スパッタ室3内に充填されたアルゴンガスは、供給口5 を介して供給され、排出口6を介して排出される。

【0025】ターゲット2は、取換可能になっており、

6

基板1の表面に所望とする膜が形成される毎に取換えられる。基板1の表面には、図3に示されるように、電極23、圧電層24、電極23、接合層22の順に蒸着され、圧電部材21が形成される。

【0026】基板1は、酸化マグネシウム、チタン酸ストロンチウム、アルミナ、サファイアなどの単結晶から構成される。電極23は、白金、アルミニウム、金、銀などを材料にして形成される。本実施例では、電極23は、後述する基板除去工程におけるエッチング処理の際の耐エッチング性に優れた白金によって形成されている。圧電層24は、PZTやPLZTなどの圧電性および電歪性を有する材料で形成される。接合層22は、ガラスまたはシリコンを材料として形成される。

【0027】圧電層24の厚さは、 0.1μ m $\sim 10\mu$ mの値に設定される。電極22の厚さは、数百オングストロームの値に設定される。接合層22の厚さは、 0.1μ m \sim 数 μ mの厚さに設定される。

【0028】圧電層24は、蒸着によって形成されるので、結晶で構成されており、その結晶のC軸は、圧電層24の厚み方向に配向されている。

【0029】図4は、圧電部材21aと圧電部材21b とを陽極接合法によって接合する接合工程を示す図である。なお、ここでは図4における下側の圧電部材21a の各構成要素は符号に添字aを付けて示し、上側の圧電 部材21bの各構成要素は符号に添字bを付けて示す。

【0030】まず、下側の圧電部材21aを、導電性を有するホットプレート27上に載置し、銀ペースト28を塗布して、接合層22aとホットプレート27とを電気的に接続する。次に、上側の圧電部材21bを、接合層22bと接合層22aとが対向するようにして下側の圧電部材21aに密着させる。このとき、上側の接合層22bはシリコンで形成され、下側の接合層22aはガラスで形成されているものとする。また、接合層22aおよび22bの互いに対向する面は、鏡面状に研磨されていることが好ましい。

【0031】このように圧電部材21aおよび21bが密着されると、上側の圧電部材21bの基板1bに電極26が当接され、電極26とホットプレート27との間に200~1000ボルトの電圧が印加される。このとき印加される電圧は、電圧の印加によって生じる電場が、シリコンによって形成される接合層22bからガラスによって形成される接合層22aの方向へ向くように与えられる。電圧の印加と平行して、接合層22a,22bの温度が、たとえば400℃になるようにホットプレート27による加熱が行われる。

【0032】このように電圧の印加と加熱とを行うと、接合層22aを形成するガラスに含まれるナトリウムイオンが、電場の作用によって接合層22aの接合層22 bと対向しない側の表面に移動し、ガラス中に残った多

30

量の負イオンが接合層22aの接合層22bと対向する 表面に移動して空間電荷層を形成する。その結果、接合層22aと接合層22bとの間に強い吸引力が生じ、接 合層22aと接合層22bとが化学結合される。

【0033】図5は、基板1bを除去する基板除去工程を示す図である。前述の図4の接合工程によって、2つの圧電部材21a,21bが接合されると、電極23a,23bおよび圧電層24a,24bなどが積層されて成る積層体32の両端部に、基板1a,1bがあるので、さらに図4の接合工程を行うためには、2つの基板 101a,1bのうちのいずれか一方を除去して、電極23aまたは23bを露出させる必要がある。基板1bの除去は、研磨によって基板1bをあらかた取除いた後、研磨によって取残した基板1bをあらかた取除いたが、基板1bの代わりに基板1aを取除いてもよい。

【0034】基板1bを、図5の基板除去工程で除去すると、図4の接合工程を行ってさらに積層を行う場合には、露出された電極23bの表面に前述の接合層22と同様な接合層が形成される。このように接合層が形成された圧電部材31を用いて、図4の接合工程を行うことによって、積層体32の積層数を、さらに増加することができる。

【0035】図4の接合工程と図5の基板除去工程とを 繰返すことによって、図6に示されるように、積層体3 2を、所定の積層数まで積層することができる。図4の 接合工程では、劈開またはダイアモンドカッタによる切 断によって複数に分割された圧電部材21,31同士を 接合してもよい。また、圧電部材21と圧電部材31と を接合してもよい。

【0036】このようにして積層が行われると、電極層33a,33bと圧電層24とが交互に所定の積層数だけ積層された積層体32を得ることができる。積層体32の両端部、すなわち図6における上下方向の端部は、単一の電極23から成る電極層33a,33bとなっている。各圧電層24の間に介在される電極層33a,33bは、2つの電極23の間に2つの接合層22が介在された構成となっている。積層体32の上端部の基板は、取除かれているが、下端部の基板1は取除かれずに保存されている。本実施例では、積層体32の積層数は、圧電層24が100層になるように設定されている。。

【0037】図7は、積層体32の側面に絶縁層36,37を形成する絶縁層形成工程を示す図である。二酸化ケイ素やガラスなどの材料から成る一対の絶縁層36,37は、積層体32の側面に、互いに対向するようにして形成される。絶縁層36,37は、CVD (Chemical Vapor Deposition) 法またはスパッタ法によって形成される。絶縁層36,37の厚さは、数百オングストロームから数千オングストロームの値に設定される。

R

【0038】図8は、絶縁層36,37に溝36a,37aを形成するエッチング工程を示す図である。絶縁層36に形成される複数の溝36aは、奇数番目の各電極層33aの一端部、図8では左端部が露出するように形成される。絶縁層37に形成される複数の溝37aは、偶数番目の各電極層33bの他端部、図8では右端部が露出するように形成される。絶縁層36,37の溝36a,37aの形成は、FIB (Focused Ion Beam) 法によって行われる。

10 【0039】図1を参照して、エッチング工程が行われると、各絶縁層36,37の表面に外部電極42,43を形成する外部電極形成工程が行われる。白金、アルミニウムおよび銀などから成る外部電極42,43が形成されると、外部電極42,43は溝36a,37aに嵌まり込み、各電極層33a,33bの電極23と電気的に導通する。これによって、奇数番目の電極層33aは、図1における左側の外部電極42に接続され、偶数番目の電極層33bは、図1における右側の外部電極43に接続される。外部電極42,43は、斜めスパッタ20法によって形成され、基板1表面に形成される接続電極42a,43aと一体にして形成される。

【0040】接続電極42a,43aには、それぞれワイヤーボンディングなどによってリード線44,45が接続される。

【0041】このように構成されたマイクロアクチュエータ41において、リード線44,45を介して外部電極42,43間に、電圧が印加されると、互いに隣接する電極層33a,33b間に電位差が生じる。各電極層33a,33bは両側の外部電極42,43のいずれか一方に交互に接続されるので、各電極層33a,33bの図1における上側に生じる電場と下側に生じる電場とは互いに逆向きとなる。このように電圧の印加によって電場が生じると、互いに隣接する圧電層24同士では、圧電特性および電歪特性が逆向きとなるように圧電層24が積層されているので、全ての圧電層24が縮み変位し、または伸び変位し、これに伴って積層体32の全体の厚さが変化する。

【0042】たとえば、数ボルトの電圧を印加した場合、積層体32の全体の厚さが0.1パーセントから数パーセントの間で変化する。圧電層24の積層数が100層となるように積層すると、積層体32の全体の厚さは0.2から0.3mmであるので、数ボルトの電圧印加で、積層体32の厚さは0.2μmから2μmだけ変位する。

【0043】マイクロアクチュエータ41に外力が与えられ、積層体32が積層方向に押しつぶされたり引伸ばされたりすると、これに伴って各圧電層24が縮み変位または伸び変位し、その結果、各電極層33a,33b間に電位差が生じる。この電位差をリード線44,4550を介して検出することによって、マイクロアクチュエー

30

タ41に与えられている外力の大きさや、積層体32の 縮み変位または伸び変位の大きさを検知することができ る。

【0044】したがって、マイクロアクチュエータ41 の各圧電層 24 は、成膜工程による蒸着によって形成されるので、従来では数十 μ m以上であった厚さを0.1 μ m ~ 10 μ mの値にすることができる。その結果、従来では数百ボルトであった駆動電圧を、大幅に小さく、たとえば数ボルトにすることができる。これによって、マイクロアクチュエータ41の駆動が、通常のICで可能となり、マイクロアクチュエータ41の制御が容易になる。

【0045】また、電極23および接合層22も成膜工程による蒸着によって形成されるので、従来のようにグリーンシートに導電体ペーストを塗布して電極層を構成する方法に比べて、電極層33a,33bの厚さを薄くすることができ、その結果、マイクロアクチュエータ41の厚さを薄くすることができる。また、1層当たりの圧電層24の厚さは薄いのであるが、図4の接合工程および図5の基板除去工程を繰返すことによって、所望の数だけ圧電層24を積層することができる。

【0046】また、圧電層24が結晶で構成され、その結晶のC軸が圧電層24の厚み方向、すなわち積層方向に配向されているので、各電極層33a,33b間に電圧が印加された場合における圧電層24の伸び変位率および縮み変位率を大きくすることができ、また圧電層24が外力によって伸び変位または縮み変位された場合における各電極層33a,33b間に生じる電位差を大きくすることができる。その結果、従来のマイクロアクチュエータに比べて、電歪特性および圧電特性に優れたマ30イクロアクチュエータを実現することができる。

【0047】電歪特性が向上すると、印加する駆動電圧に対して、マイクロアクチュエータ41が伸び変位または縮み変位する大きさが大きくなるので、低電圧で駆動可能で、厚みの薄い小形化に適したマイクロアクチュエータ41を実現することができる。

【0048】圧電特性が向上されると、マイクロアクチュエータ41が加速度センサなどに用いられた場合、マイクロアクチュエータが伸び変位または縮み変位される大きさに対して、互いに隣接する各電極層33a,33b間に生じる電位差が大きくなるので、厚さの薄い小形のマイクロアクチュエータ41で微小変位を高精度で検出できる。

【0049】また、積層体32の側面に絶縁層36,37を形成した後、絶縁層36,37に溝36a,37aを形成するので、従来の筋状の絶縁体を形成する場合に比べて、作業を高精度で、かつ簡単に行うことができ、その結果、マイクロアクチュエータ41の製造工程の簡略化および歩留りの向上を図ることができる。

【0050】また、リード線44,45は、基板1表面 50

10

に形成された接続電極42a,43aに接続されるので、リード線44,45を外部電極42,43が積層体32の側面に対向する部分に接続する場合に比べて、積層体32の伸び変位または縮み変位によってリード線44,45が剥離してしまうようなことがなく、リード線44,45の接続状態の信頼性を向上することができる。

【0051】また、図4の接合工程には陽極接合法が用いられるので、厚さの薄い接合層22を形成することによって接合を行うことができ、マイクロアクチュエータ41の厚みを厚くすることなく、積層体32を積層することができる。

【0052】また、図8のエッチング工程ではFIB法が用いられるので、収束イオンビームが照射される部分から放射される2次電子を電子レンズなどによって捕獲し、視角化することによって、収束イオンビームが照射される部分を確認しながら溝36a,37aを形成することができる。その結果、正確な位置に、溝36a,37aを形成することができる。

【0053】なお上述の実施例では、2つの圧電部材2 1,31の接合に、陽極接合法を用いたが、表面活性化接合法または接着剤接合法が用いられてもよい。

【0054】また、上述の実施例では、図8のエッチング工程においてFIB法を用いたが、RIE法などのドライエッチング法、またはウェットエッチング法を用いてもよい。

【0055】また、上述の実施例では図2の成膜工程で、RFマグネトロンスパッタ法を用いたが、CVD法を用いてもよい。

【0056】また上述の実施例では、積層体32の片側の基板1を除去せずに残し、その基板1に接続電極42。 a,43aを形成したが、基板1を残さずに除去してもよい。接続電極42a,43aを形成するための基板が必要である場合には、新たな基板を積層体32の一端部に接続すればよい。

[0057]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、蒸着によって圧電層および電極層を形成するので、圧電層および電極層の厚さを大幅に薄くすることができる。圧電層の40 厚さを薄くすることによって、従来では数百ボルトであった駆動電圧を、大幅に小さく、たとえば数ボルトにすることができる。電極層の厚さを薄くすることができる。

【0058】また、圧電層が結晶で構成され、その結晶のC軸が圧電層の厚み方向に配向されているので、圧電層の結晶性を向上することができる。その結果、電歪特性および圧電特性に優れたマイクロアクチュエータを実現することができる。

【0059】また、成膜工程で形成された厚さの薄い圧

11

電層および電極層を、接合工程と基板除去工程とを繰返 すことによって所定の積層数に積層するので、従来より も厚さの薄い圧電層および電極層によって積層体を形成 することができる。

【0060】また、絶縁層を形成した後、その絶縁層に 溝を形成するので、従来に比べて作業を高精度で、かつ 簡単に行うことができ、その結果、マイクロアクチュエ ータの製造工程の簡略化および歩留りの向上を図ること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のマイクロアクチュエータ4 1の構成を示す斜視図である。

【図2】基板1表面に電極23、圧電層24および接合層22を形成する成膜工程を示す図である。

【図3】成膜工程によって形成された圧電部材21の構成を示す斜視図である。

【図4】陽極接合法によって2つの圧電部材21a,2 1bを接合する接合工程を示す図である。

【図5】基板1bを除去する基板除去工程を示す図である。

【図6】積層体32が所定の積層数だけ積層された状態を示す図である。

【図7】絶縁層36,37を形成する絶縁層形成工程を示す図である。

12 【図8】絶緑層36,37に溝36a,37aを形成するエッチング工程を示す図である。

【符号の説明】

1, 1a, 1b 基板

2 ターゲット

3 スパッタ室

4 永久磁石

7 ヒータ

8 RF電源

10 21, 21a, 21b, 31 圧電部材

22, 22a, 22b 接合層

23, 23a, 23b 電極

24, 24a, 24b 圧電層

26 電極

27 ホットプレート

28 銀ペースト

3 2 積層体

33a,33b 電極層

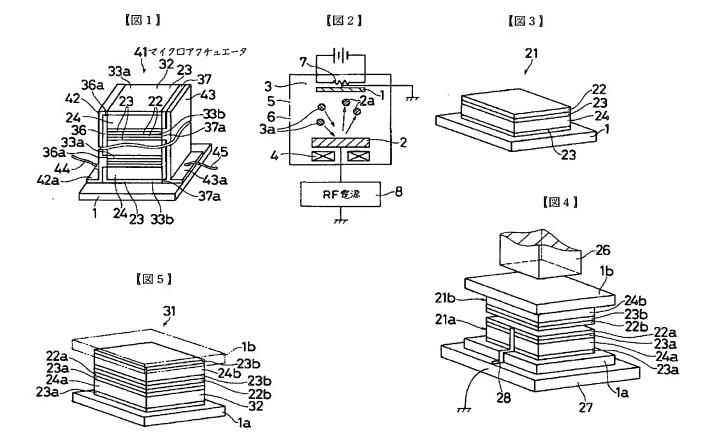
36,37 絶縁層

20 36a, 37a 溝

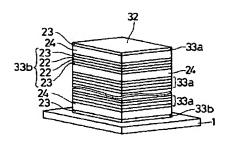
42,43 外部電極

42a, 43a 接続電極

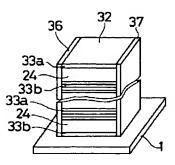
44, 45 リード線



【図6】



【図7】



【図8】

